

本地区の見掛比抵抗は 21.1～606Ωm の範囲にあり、平均値は約 130Ωm である。分極率は 1.1～29.1mV/V の範囲にあり、平均値は 12.0mV/V である。

地下浅部では、測線 900S の測点 28 付近を中心として低比抵抗、高分極率異常が認められる。この異常の分布範囲は地表の既知鉱徴地と一致しており、鉱徴地による IP 異常であると考えられる。深部(N=3 以深)でも低比抵抗、高分極率が認められるが、これらは浅部の異常体の影響がハの字型に広がったものである。

2-5-4 ハイル・アス・サフィール地区

ハイル・アス・サフィール地区の測線位置図を Fig. II-2-31 に示す。本地区では第 2 年次に、測線長 1.0km の東西測線を 10 本、測線長 1.3km の南北測線を 2 本設定して測定を実施した。TDIP 断面図及び平面図をそれぞれ Fig. II-2-32, 33 に示す。また、2 次元解析断面図及び平面図をそれぞれ Fig. II-2-34, 35 に示す。

本地区の見掛比抵抗は 4.1～2,676Ωm の範囲にあり、平均値は 116Ωm である。分極率は 0.5～62mV/V の範囲にあり、平均値は 13.6mV/V である。本地区では、アル・アシュガル、ハイル・アス・サフィール、ビシャーラ、アル・ジャディードの 4 つの鉱体が既に確認されている。第 2 年次の調査範囲にはアル・アシュガル鉱体の一部、ビシャーラ鉱体およびハイル・アス・サフィール鉱体が含まれる。

それぞれの鉱体に対応する明瞭な IP 異常が認められる。アル・アシュガル鉱体では深度 80m 以浅に低比抵抗・高分極率が分布し、塊状硫化物鉱体を反映した異常と考えられる。塊状硫化物を主体とするビシャーラ鉱体では低比抵抗・高分極率が地表付近から深度 100m までの範囲に分布する。ハイル・アス・サフィール鉱体でも低比抵抗・高分極率が認められるが、その深度はビシャーラ鉱体よりも深く、深度 50m 以深で現れている。

既存の鉱体以外の IP 異常としては、ゴッサン東部を測線 1800N～2100N の範囲で南北に分布する高分極率異常が認められる。この高分極率異常帯では概して高比抵抗が分布するが、北端と南端の一部で局所的に低比抵抗が認められる。その他、測線 2300N、測点-35.5 付近の局所的な低比抵抗・高分極率異常および第 1 年次の測線 3600W、測点 24.0 付近の局所的な低比抵抗・高分極率異常が認められる。

2-5-5 ナジャイド地区

ナジャイド地区の測線位置図を Fig. II-2-36 に示す。本地区では第 2 年次に測線長 0.8km の東西測線を 5 本、南北測線を 1 本設定して測定を実施した。TDIP 断面図及び平面図をそれぞれ Fig. II-2-37, 38 に示す。また、2 次元解析断面図及び平面図をそれぞれ Fig. II-2-39, 40 に示す。

本地区の見掛比抵抗は 52.5～687Ωm の範囲にあり、平均値は 257Ωm である。分極率は 1.8～27.2mV/V の範囲にあり、平均値は 13.6mV/V である。

本地区では、見掛比抵抗は全体的に高い値を示しており、極端な低比抵抗は認められない。分

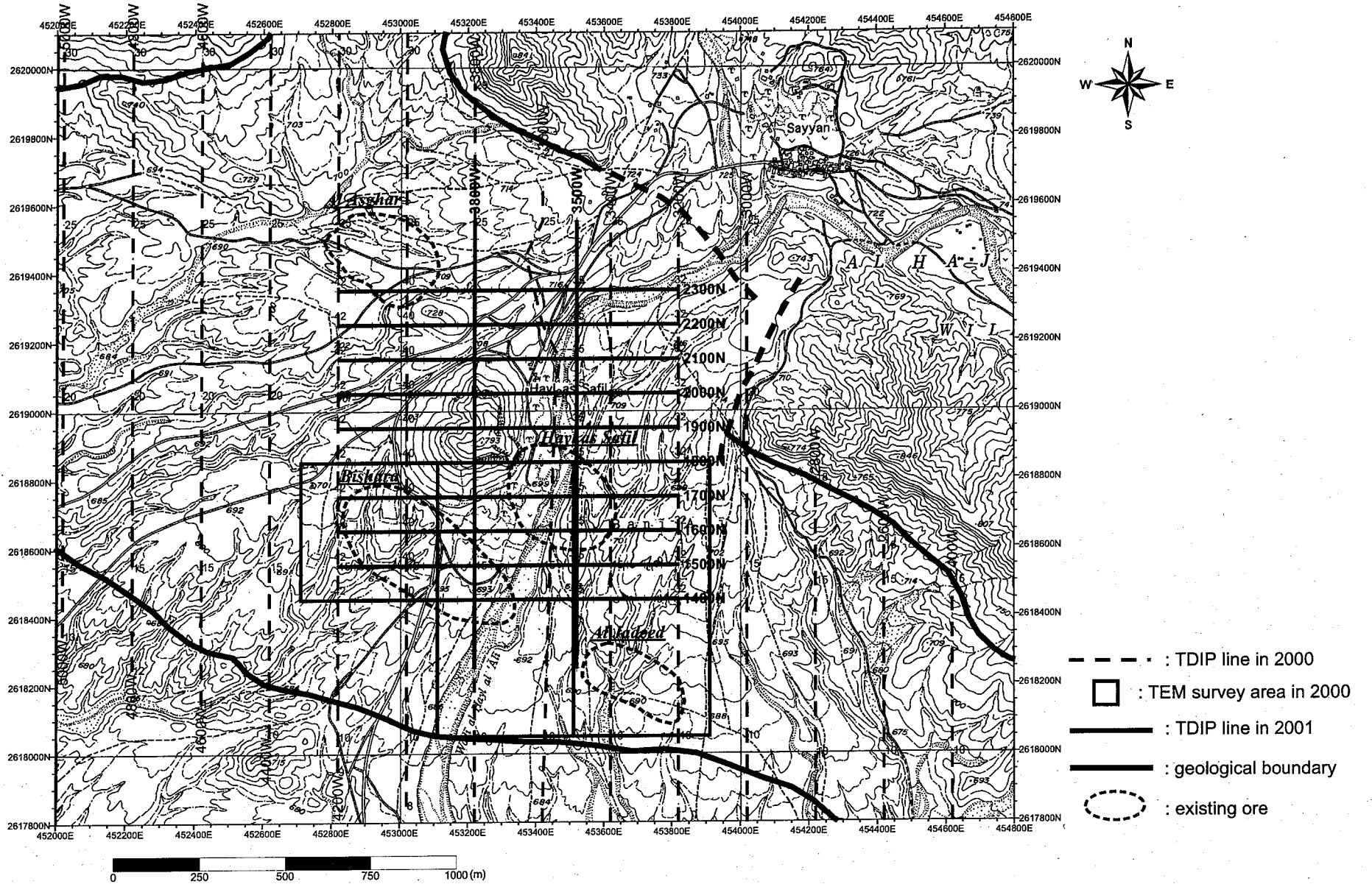


Fig. II -2-31 Geophysical survey location in Hayl as Safil area

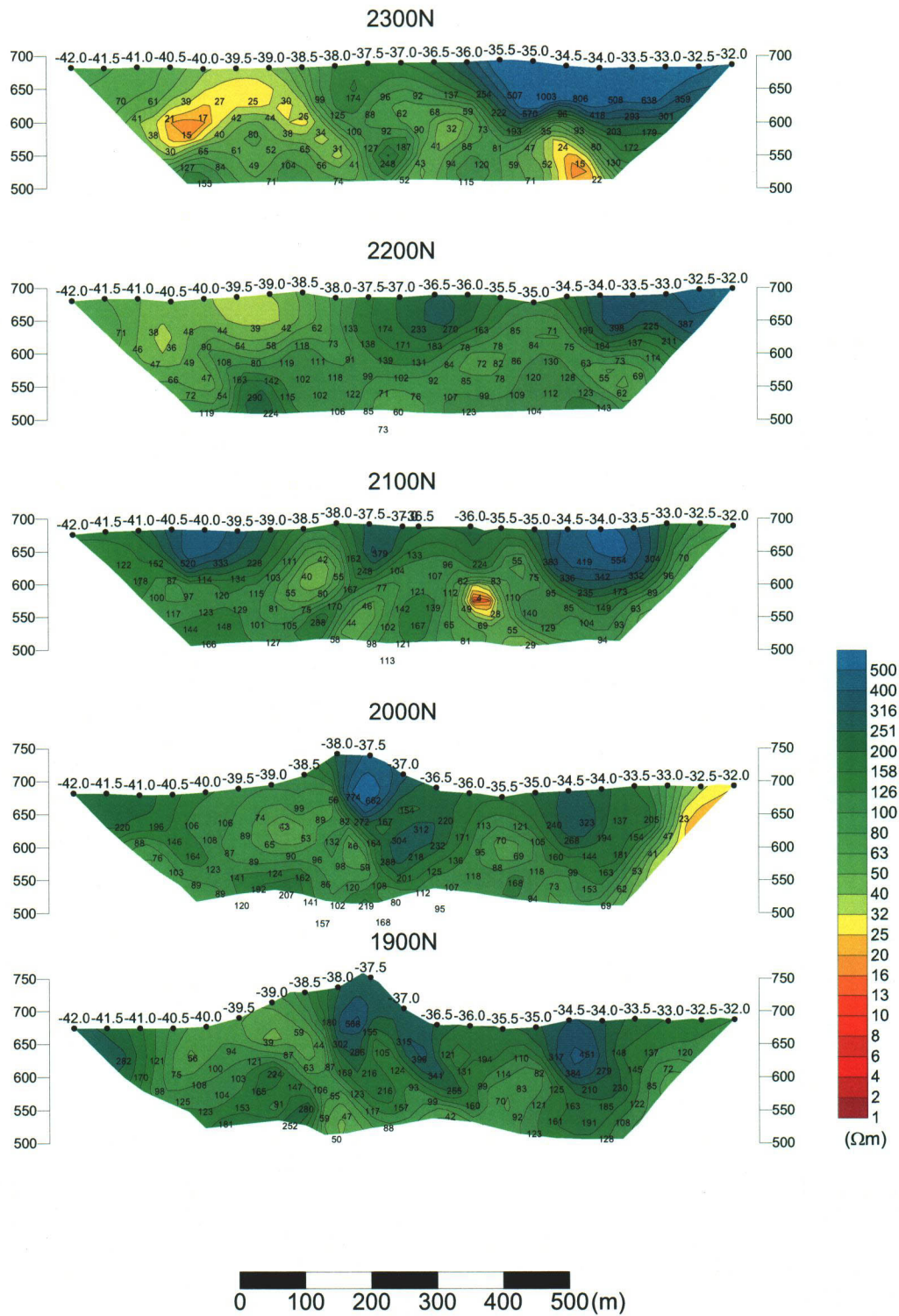


Fig. II -2-32(1) Apparent resistivity pseudo-sections in Hayl as Safil area(2300N – 1900N)

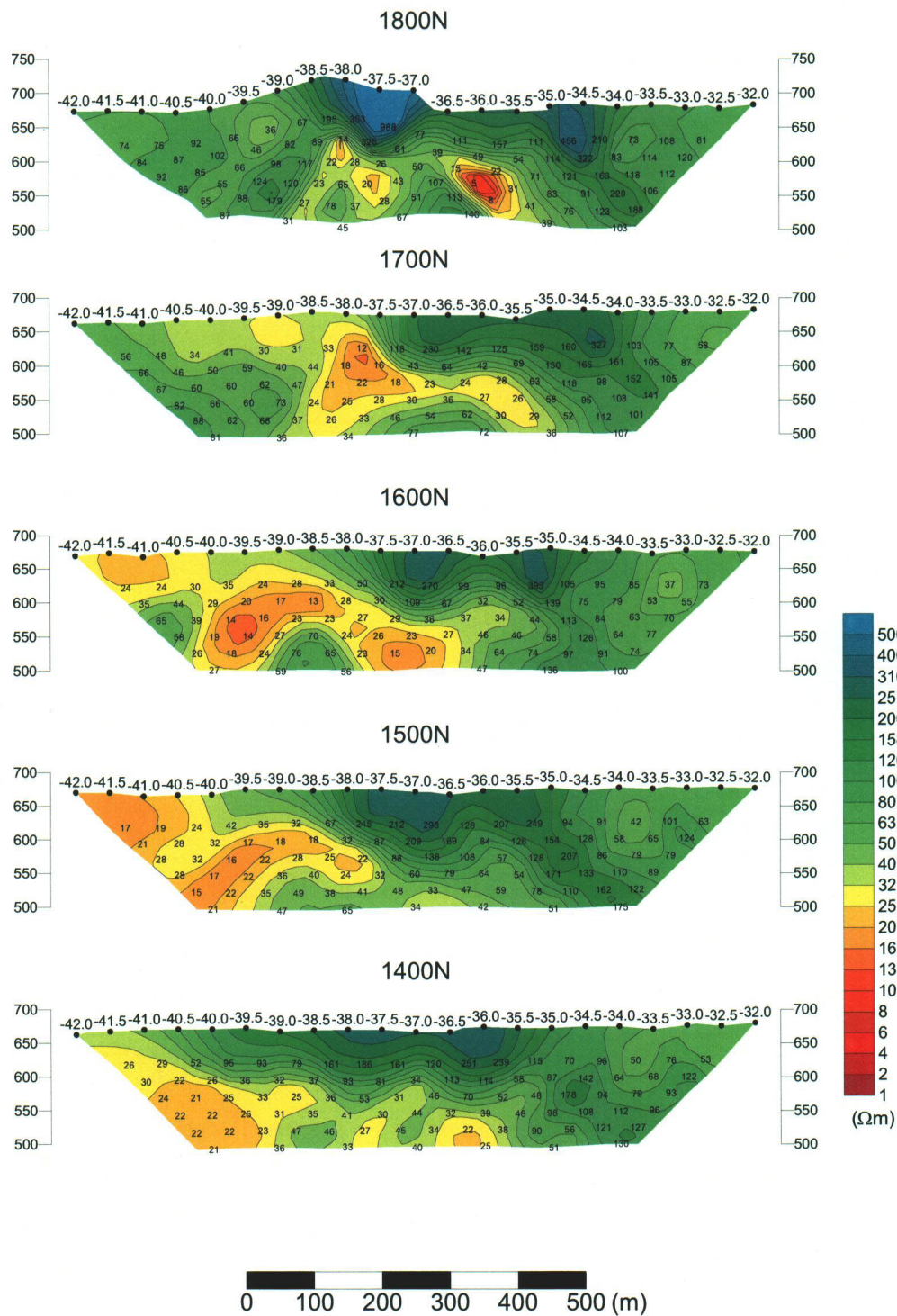


Fig. II -2-32(2) Apparent resistivity pseudo-sections in Hayl as Safil area(1800N – 1400N)

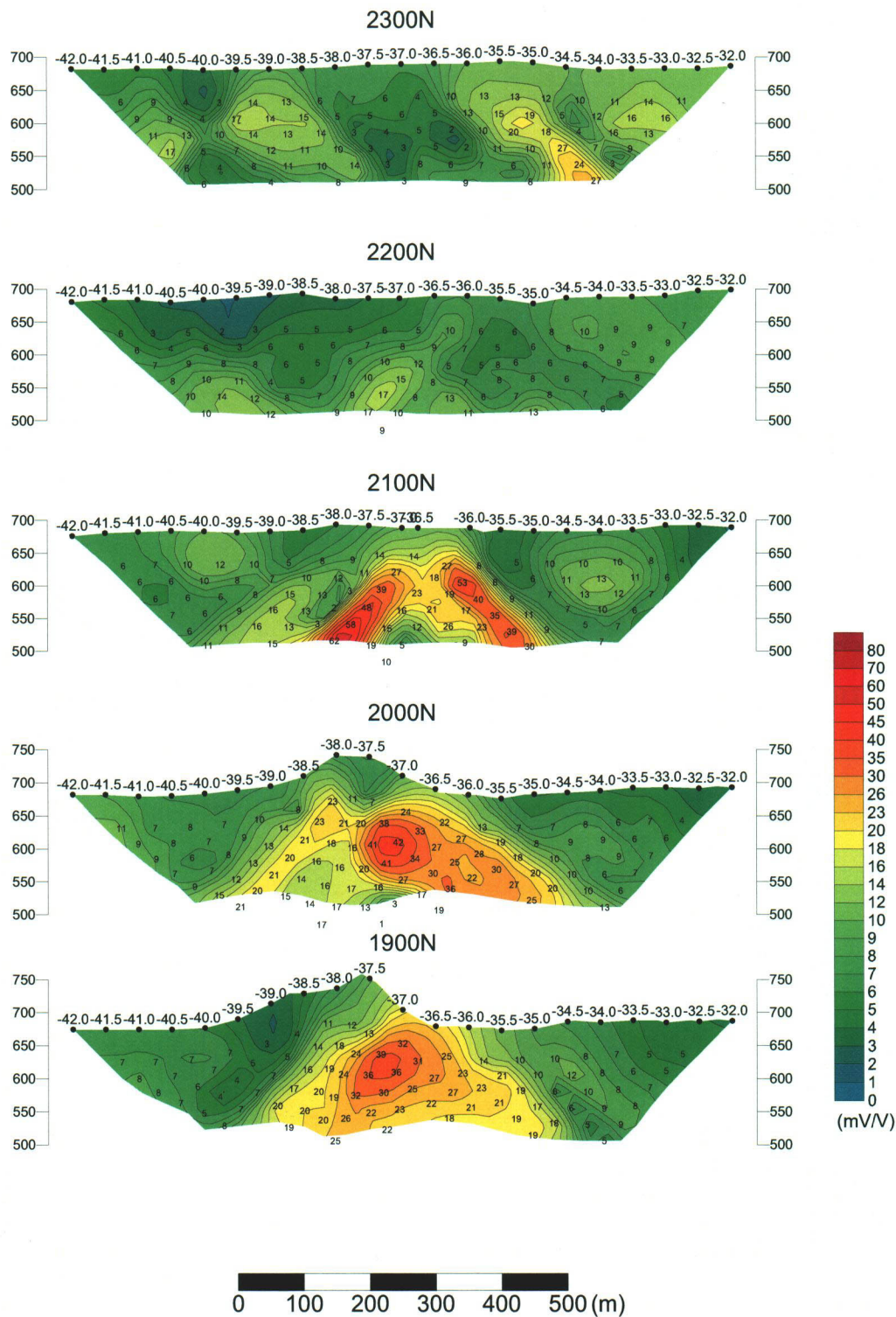


Fig. II -2-32(3) Chargeability pseudo-sections in Hayl as Safil area(2300N – 1900N)

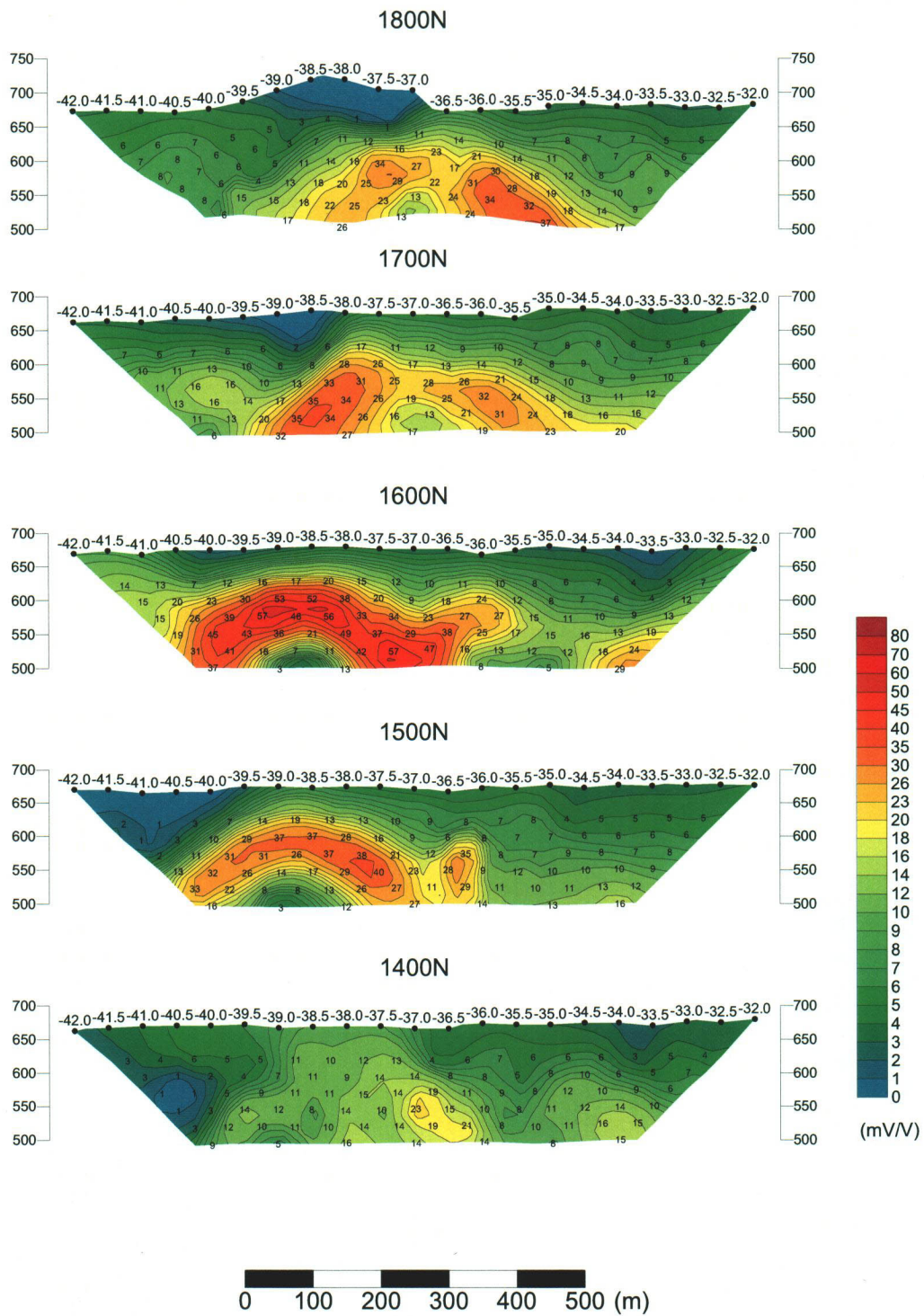


Fig. II -2-32(4) Chageability pseudo-sections in Hayl as Safil area(1800N – 1400N)

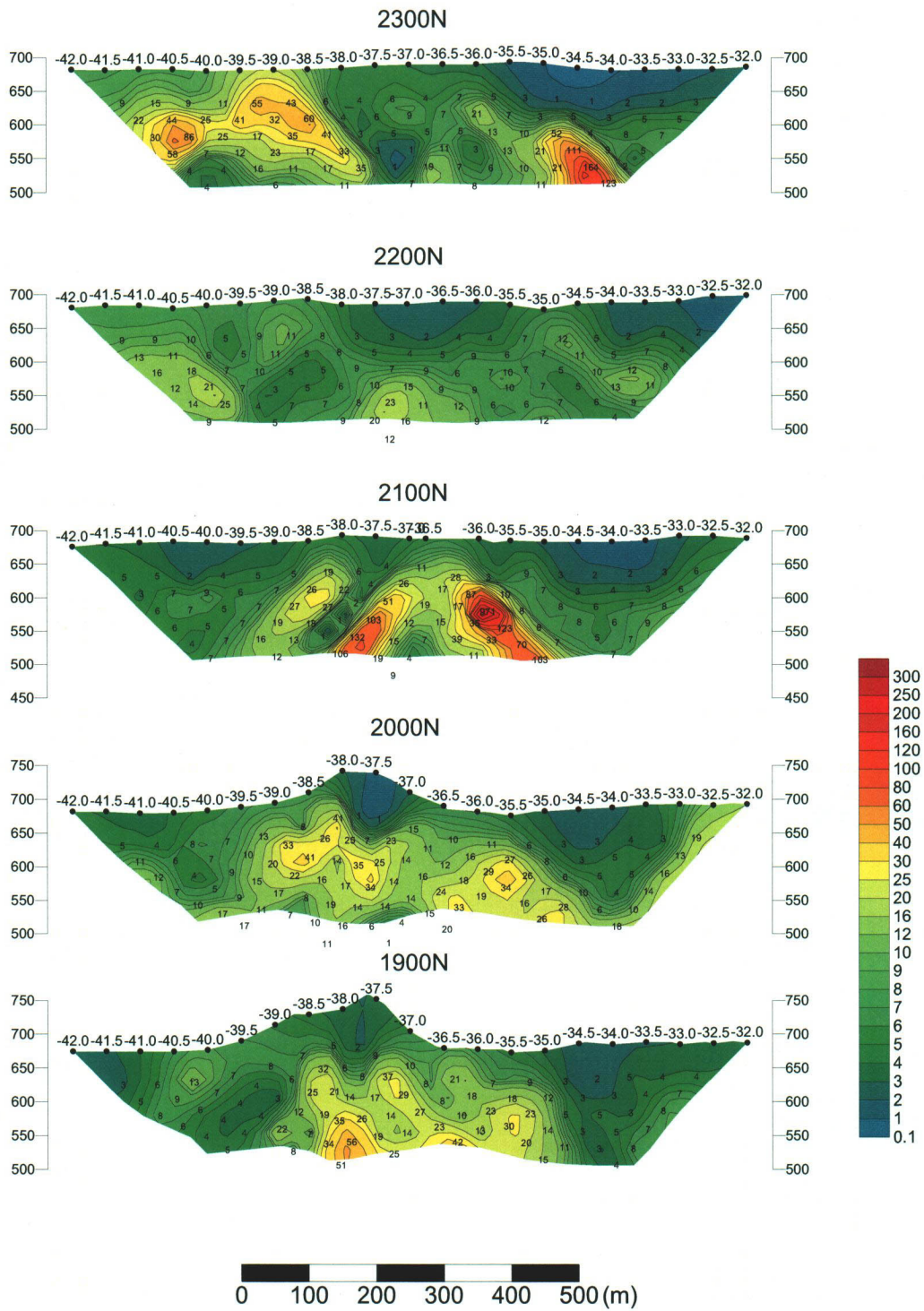


Fig. II -2-32(5) Metal factor pseudo-sections in Hayl as Safil area(2300N – 1900N)

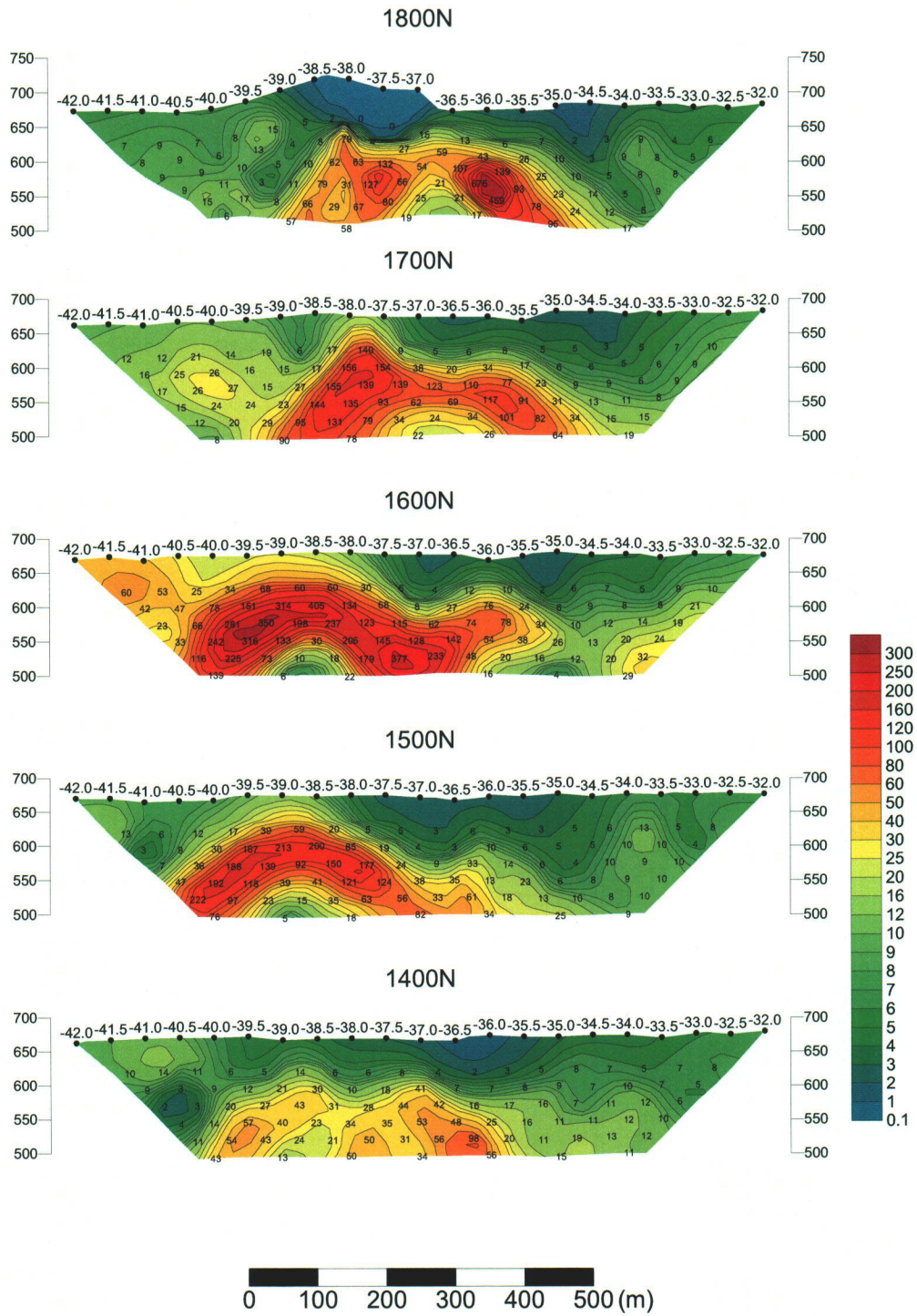
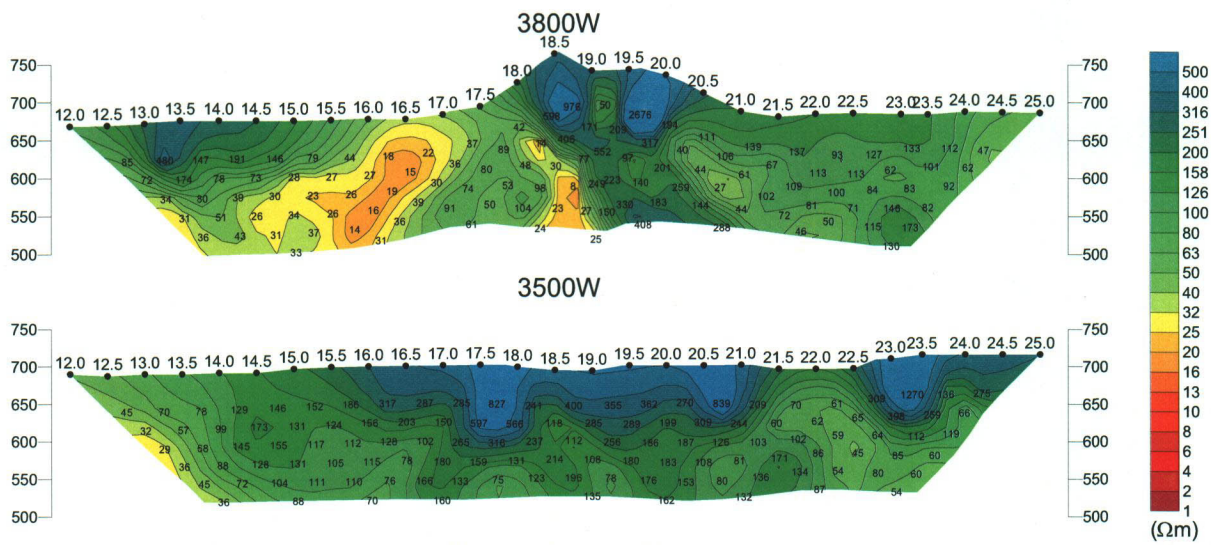
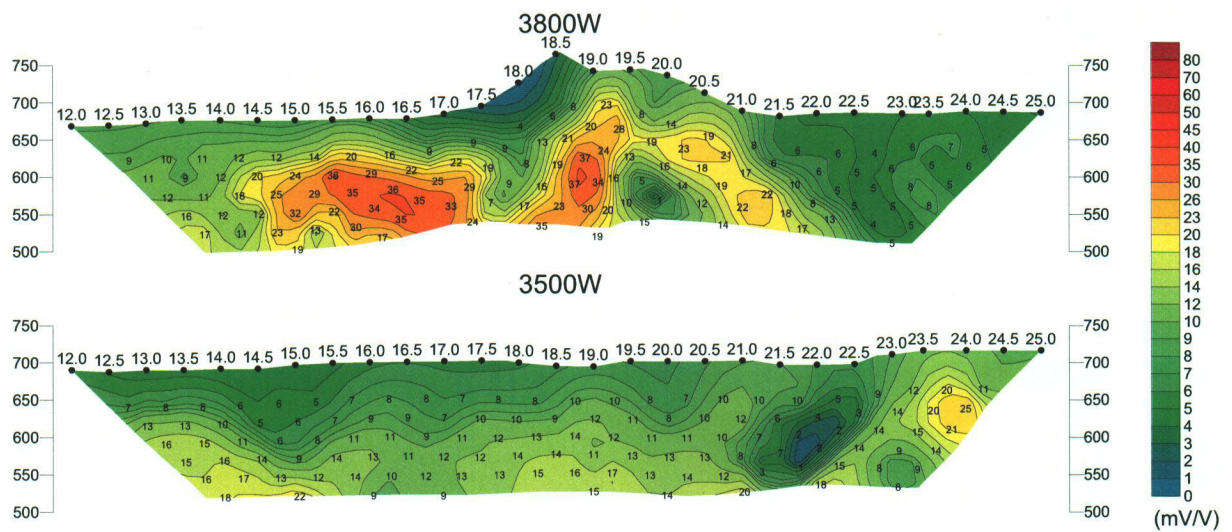


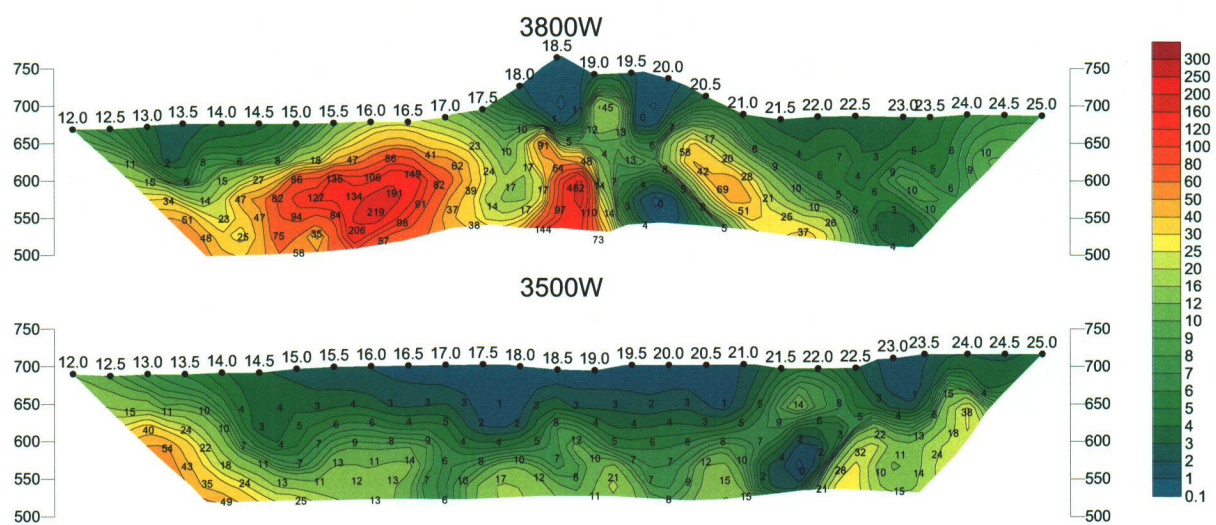
Fig. II -2-32(6) Metal factor pseudo-sections in Hayl as Safil area(1800N – 1400N)



Apparent resistivity



Chargeability



Metal factor



Fig. II -2-32(7) TDIP pseudo-sections of N-S lines in Hayl as Safil area